

Анализ чувствительности некоторых карт статистического контроля методом имитации

Kalm, Evald; Koik, Peeter Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 85-92

https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

Качественный анализ обобщенной динамической модели химико-технологической системы

Aarna, Olav Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 101-114 : илл

https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

Лавинное размножение носителей заряда в дополнительных р-п-переходах

Velme, Enn Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 3-14 : илл

https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

Машинное моделирование цепи питания, обеспечивающей инжекторный ток для И²Л схем

Rang, Toomas Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 15-19 : илл

https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

Некоторые вопросы определения области безопасной работы мощных транзисторов

Männama, Vello; Järvalt, Aldur-Eduard Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики

1981 / с. 27-32 : илл https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

Обобщенная динамическая модель химико-технологической системы

Aarna, Olav Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 93-100

https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

Повышение эффективности численных алгоритмов моделирования проводящего состояния силовых полупроводниковых структур

Freidin, Boris; Rubinštein, M.J. Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 21-

26 https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

Погрешность измерения среднего по модулю значения напряжения, обусловленная собственными шумами измерителя

Tamm, Ullas Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 51-61 : илл

https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

Разработка системы программного управления высокотемпературными операциями в производстве силовых полупроводниковых приборов

Bachverk, Aleksander; Rähmi, S. Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с.

41-50 : илл https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

Разработка устройства контроля режимов векторного вольтметра

Logunov, Gennadi; Tagger, Jüri Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с.

73-84 : илл https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики

1981 https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

Трансляция выходных реакций многовыходного модуля

Plakk, Mari Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 63-72 : илл

https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

Экспериментальное исследование формирования электрических параметров тиристорной структуры

Bachverk, Aleksander Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 33-39

https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>